#### ESTUDO DO HIDROGÊNIO NO α-QUARTZO NATURAL BRASILEIRO

## UTILIZANDO A TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA INFRAVERMELHA

JANUNCIO AFONSO DE MEDEIROS NETO

Orientador: Prof. Dr. RAM S. KATYAR

Orie
Este exemplor corresponde

Or reduced poul du tese
dejende du pelo Aluno JA

NUNCIO AFONSO DE MEDEIROS

NETO, e aprovado pelo
comissas julgadora.

Tese apresentada como pré-requisito para a obtenção do título de MESTRE EM FÍSICA pela Universidade Estadual de Campinas.

À minha mãe e aos meus irmãos.

#### **AGRADECIMENTOS**

Ao Prof. Ram S. Katyar, pela orientação deste trabalho.

Ao Prof. Sanjurjo, pelas sugestões e discussões esclarecedoras.

Aos técnicos Rinaldo e Alexandre, pela ajuda nos levantamentos de dados experimentais.

Aos colegas Silvânia, Telma , Madaki, Luiz e Edson, pelo compartilhamento de uma boa amizade e, principal mente, pela força e estímulo durante todo decorrer deste trabalho.

Aos amigos Helder, Djalma, Eli, Douglas, Gorety, Hiran e Paulo Rosas.

Queria deixar registrado aqui um agradecimento especial ao amigo Gilvan e sua esposa, pelo apoio nas horas adversas.

À Jeanne que, apesar da distância, sempre este ve presente.

Ao amigo Sasaki, pela confecção das tabelas e das figuras.

À Júlia, pela paciência e esmero no trabalho de datilografia.

Ao CNPq e ao IFGW, pelo suporte financeiro.

Aos colegas que aqui deixei de mencionar e que, de uma forma ou de outra, contribuiram para que fosse possível este trabalho.

## ABSTRACT

In this work the infrared transmission spectroscopy is used to determine quantitatively the amount of Hydrogen in several kinds of Brazilian  $\alpha$ -quartz. The orientational anisotropy of OH bonds are also studied. We show that the knowledge of the proper orientational factor is crucial in order to obtain the correct H concentration when Paterson's formula is used. Moreover, the measurent of the absorption coeficient in region at about  $\approx 3\mu$  is very important for those application of optical transmission in the near infrared such as for telecomunication with quartz glass-fibers.

## RESUMO

Neste trabalho a técnica de espectroscopia infravermelha é utilizada para determinar quantitativamente hidrogênio em diver sas qualidades de α-quartzo natural brasileiro. Estuda-se tambem o caráter anisotrópico das ligações OH e mostramos que o fator de orientação é um parâmetro crucial na determinação correta da concentração de H quando a fórmula de Paterson é utilizada. Consequentemente, a medida do coeficiente de absorção na região em tor no de 3μ do espectro eletromagnético é bastante importante para as aplicações de transmições opticas na região próximo do infravermelho, particularmente para as área de telecomunicações que utilizam fibras ópticas.

## INDICE

INTRODUÇ	ÃO	••••••••••••••••••	1
CAPÍTULO	1 .		
	1.1.	AS FORMAS DO SiO <sub>2</sub>	5
	1.2.	VARIEDADES DE QUARTZO-α	9
•	1.3.	IMPUREZAS E DEFEITOS NO QUARTZO-α	11
	1.4.	APLICAÇÕES	15
CAPÍTULO	2		
	2.1.	TEORIA INFRAVERMELHA	18
	2.2.	ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DO QUARTZO- $\alpha$	22
	2.3.	ANÁLISE QUANTITATIVA DOS ESPECTROS INFRAVERME	
		LHOS	28
	2.4.	ANÁLISE QUANTITATIVA DE H NO QUARTZO- $\alpha$	35
	2.5.	O FATOR DE ANISOTROPIA	40
CAPÍTULO	3		
	3.1.	INSTRUMENTAÇÃO	42
		3.1.a. FONTES DE RADIAÇÃO	42
		3.1.b. DETETORES	43
		3.1.c. POLARIZADORES	44
		3.1.d. FILTROS E REDES DE DIFRAÇÃO	44
		3.1.e. SISTEMA ÓPTICO DO PE-180	46
	3.2.	SELEÇÃO E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS	48

3.3. MEDIDAS	50
3.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	53
3.4.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE H EM	
AMOSTRAS ORIENTADAS CRISTALOGRAFICAMENTE	53
3.4.2. CÁLCULO DA CONCENTRAÇÃO DE H CONSIDERAN	
DO DISTRIBUIÇÃO ISOTRÓPICA PARA OS DIP <u>O</u>	
LOS OH	54
3.4.3. DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO "MÉDIO" $\alpha$	58
3.4.4. VARIAÇÃO LOCAL DE H EM PLACA DE QUARTZO	61
3.4.5. A CONCENTRAÇÃO DE H EM LASCAS DE 17, 27	
e 3ª e MISTAS	62
CONCLUSÕES	74
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	77

APÊNDICE

## INTRODUÇÃO

O quartzo é um mineral encontrado abundamente na na tureza composto de Silício e Oxigênio, tendo importantes aplicações tecnológicas e tem sido objeto de inumeráveis estudos.

A primeira aplicação prática do quartzo se deu na indústria óptica, mais especificamente na construção de mas destinados a espectrômetros que operam na região do ultra -violeta do espectro eletromagnético, devido a apresentar al ta transmissão para comprimentos de onda abaixo de 2000 A .En tretanto, devido as suas propriedades piezo-elétricas,o quart cristalino encontra na indústria eletrônica a mais significativa e importante aplicação, particularmente como controladores precisos de freqüência, devido ao fato de pos suir uma rara e excepcional combinação de propriedades físi cas que o tornam excepcionalmente ideal para tal finalidade.

O quartzo também é amplamente utilizado na indústria de vidros, fundição, etc., sendo que no atual estágio de de senvolvimento tecnológico é utilizado como matéria-prima na fabricação de fibras ópticas.

O espectro de absorção óptico de um cristal de quart

zo livre de qualquer defeito ou impureza é caracterizado por uma região de alta transparência que se inicia com a banda de absorção eletrônica próximo a 69000 cm<sup>-1</sup> e estendendo - se até a região intermediária do infravermelho por volta de 3000 cm<sup>-1</sup>. Abaixo de 3000 cm<sup>-1</sup> existem fortes bandas de absorção que são originadas dos overtones e das freqüências fundamentais da rede.

Entretanto, devido a sua origem hidrotérmica,o quartzo apresenta em sua estrutura cristalina diferentes e varia das concentrações de impurezas que modificam consideravelmente o espectro de absorção nas diversas regiões de transparênte cia [25-29] influenciando as propriedades físicas do cristal e provocando restrições nos diversos campos de aplicabilidade, particularmente na indústria eletrônica e na fabricação de finas ópticas.

A região em torno de 3000 cm<sup>-1</sup> é caracterizada por possuir fortes bandas de absorção e tem sido objeto de inúmeros estudos [23-33].

Kats [12] provou que a origem dessas bandas são de vido às vibrações de alongamento do grupo OH na vizinhança de várias impurezas.

Levando em consideração que todas absorções em tor no de 3000 cm<sup>-1</sup>, são devido ao grupo OH, com exceção de algumas terem sido originadas na segunda ordem dos fundamentais e considerando a facilidade de obtenção dos espectros nessa região, a técnica de espectroscopia infravermelha é uma ferra menta bastante poderosa para um estudo quantitativo da impure za H nesse material.

Todas as estatísticas disponíveis apontam o Brasil como sendo o possuidor das maiores reservas mundiais conhecidas e as de melhores qualidades. A alta qualidade do quartzo brasileiro, além de suas imensas reservas espalhada pratica mente por todo território nacional torna-o o maior exportador mundial desse mineral, principalmente o quartzo de 1ª qualida de, também conhecido de quartzo grau-eletrônico [44].

Apesar do Brasil ser o maior produtor e exportador de lascas de quartzo do mundo, o quartzo destinado ao mercado externo é classificado através de simples inspeção visual, não existindo no Brasil nenhum critério mais seguro para tal finalidade.

O propósito de nosso trabalho foi a de utilizar es pectroscopia infravermelha para fazer-se um estudo comparativo

entre as várias qualidades do quartzo brasileiro utilizando como parâmetro a impureza H e um estudo em amostras orienta das cristalograficamente para verificar o caráter isotrópico ou anisotrópico na distribuição de orientação de OH.

## CAPÍTULO 1

# 1.1. AS FORMAS DO $SiO_2$

SiO<sub>2</sub>, cujo nome mais comum é sílica, é encontrada em diferentes formas alotrópicas. A maioria delas é encontrada na natureza em grandes quantidades; entretanto, algumas dessas formas só são obtidas artificialmente através de condições laboratoriais extremamente elaboradas.

As formas mais conhecidas de sílica são o quartzo, tridimita, cristobalita e os vidros de sílica amorfos. Coesita, kea vite, stishovite e melanophlogite são formas bastante raras.

Com exceção da stishovite, as formas de SiO<sub>2</sub> são construidas a partir de uma mesma unidade estrutural, o tetraedro SiC<sub>4</sub>. Em outras palavras, podemos dizer que os silícios na rede cristalina são circunvizinhados por quatro átomos de oxigênio nas direções tetraédricas; equivalentemente, cada oxigênio é ligado a dois átomos de silício, sendo que o ângulo Si-O-Si varia de uma forma a outra. A forma na qual os tetraedros são mantidos unidos vai determinar a classe de simetria cristalina do SiO<sub>2</sub>, podendo ser hexagonal, tetragonal, monoclínico, etc.

A Tabela 1.1 [Ref. 1] lista as várias formas conhec<u>i</u> das da sílica e as informações estruturais relevantes.

Tabela 1.1 - Parâmetros Estruturais das formas de  $Sio_2$ 

The co	Simetria	Parâmetro	Distânci	Angulo (o)	
Fase	Silletia	da Rede (Å)	Si-O	0-0	0-Si-O
Quartzo-α	Trigonal	a = 4.913 c = 5.405	1.61	2.60-2,67	144
Quartzo-β	Hexagonal	a = 5.01 c = 5,47	1.63	2.60	144
Tridimita (α)	Monoclinica	a = 18.54 b = 4.99 c = 23.83 $\beta = 10.56^{\circ}$	?∙	?	?
Tridimita (β)	Hexagonal	a = 5.03 c = 8.22	1.52	2.57	?
Cristobalita (α)	Tetragonal	a = 5.03 c = 6.92	1.59	2.58-2,63	147
Cristobalita (β)	Cúbico	a = 7.16	1.55	2.53	180
Keatite	Tetragonal	a = 7.456 c = 8.604	1.57-1.61	?	?
Coesite	Monoclinico	a = 7.17 b = 12.38 c = 7.17 $\beta = 120^{\circ}$	1.60-1.63	2.60-2.67	120
Stishovite (*)	Tetragonal	a = 4.17	?	?	?
Melanophlogite	Cúbico	a = 13.402	?	?	?
Silica fibroso	Ortorômbica	a = 8.36 b = 5.16 c = 4.75	?	?	3
Vidro de Sílica	Amorfo	_	1.61	2.63	<144>**

<sup>\*</sup> Esta forma possui a estrutura do rutílio, com o átomo de silício da célula unitária circunvizinhada por seis átomos de Oxigênio.

<sup>\*\*</sup> Em média.

As várias formas de sílica, quando submetidas a condições distintas de temperatura e pressão, podem sofrer modificações estruturais, isto é, transições de fase, sendo que as principais formas, tais como quartzo, cirstobalita, tridimita, etc., são encontradas tanto à baixas quanto à altas temperaturas, comumente denominadas de fase (α) e fase (β).

A Fig. 1.1 mostra o diagrama de fase para o SiO<sub>2</sub> dando os respectivos intervalos de temperatura e pressão, onde as respectivas formas são estáveis.

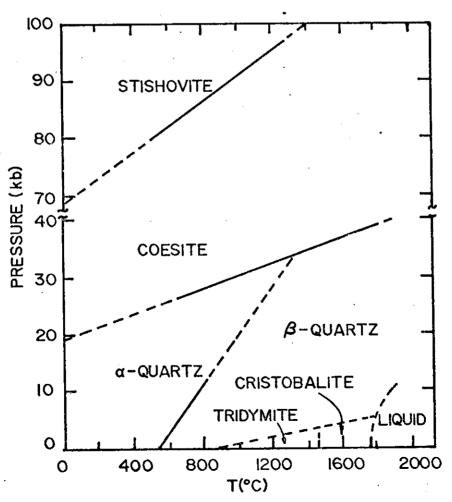


Fig. 1.1 - Diagrama de fase para as principais formas de SiO<sub>2</sub> [Ref. 2]

Da Fig. 1.1 temos que o quartzo pode ser encontrado tanto na fase-α quanto na fase-β. É importante salientar que a inversão da fase-α para a fase-β é reversível, de tal forma que para temperaturas abaixo de 573°C o quartzo sempre é encontrado na fase-α. Acima de 870°C o quartzo-β sofrerá uma nova modifica cão para a estrutura cristalina tridimita-β, passando a cristoba lita-β por volta de 1470°C. Após a tridimita-β e cristobalita -β serem formadas, as mesmas permanecerão como tridimita e cristobalita; entretanto, se são submetidas a resfriamentos, estas formas sofrerão inversão para a fase metaestável, podendo permanecer nes ta fase por períodos indefinidamente longos.

Em geral, a expansão térmica das formas mais comuns de silica é baixa à altas temperaturas. Isto é de fundamental importância prática para a obtenção de silica refratária, pois a torna capaz de resistir a mudanças bruscas de temperatura, bem como a longos gradientes térmicos.

Devido ao fato de que a inversão quartzo-β-trimidita-β na temperatura de inversão ser bastante lenta, além de existir mudança significativa no volume quartzo-tridimita, faz-se neces sário que para a obtenção da sílica refratária a forma quartzo-β seja submetida a temperaturas bem acima da temperatura de inver

são, de tal forma que a temperatura de inversão ocorra num inter
valo razoavelmente longo.

## 1.2. VARIEDADES DE QUARTZO-α

Dentre todas as formas de SiO<sub>2</sub> existentes na natureza, o quartzo-α é, sem dúvida nenhuma, o que apresenta maiores variedades e inúmeras características pecultares. As variedades mais conhecidas são:

### 1. Cristal de rocha

£ o tipo mais comum de quartzo- $\alpha$ , classificado geral mente como:

- a. Cristais Cavernosos
- b. Quartzo Drusa
- c. Quartzo de Camada

#### 2. Quartzo Esfumado

Cristais caracterizados por diversas cores, variando do amarelo ao marrom escuro. Grandes partes deles são transparentes, podendo ser encontrados também alguns quase negros. Essas

variedades de cores são devido aos centros de cores presentes na estrutura cristalina [3,4]. Acima de 300°C, as cores caracteristicas destes cristais desaparecem.

#### 3. Ametista

Cristais caracterizados pelas suas cores que vão do violeta ao violeta azul. Esses cristais normalmente apresentam ferro em sua estrutura cristalina [5,6] e raramente são encontrados como cristais isolados.

#### 4. Ametista Verde

Forma de cristal de quartzo extremamente raro, encontrado somente no Brasil.

### 5. Citrino ou Falso Topázio

Tipo de ametista colorida artificialmente. As cores são devido à incorporação do Ion Fe<sup>-3</sup> à estrutura cristalina , cuja absorção ocorre na região próxima do ultra-violeta.

#### 6. Quartzo Rosa

Cristais caracterizados pelas cores que vão do rosa - vermelho ao róseo. Supõe-se que tais cores sejam devido à presença de titânio na rede cristalina [7].

## 7. Quartzo Sintético

Cristais obtidos através de variadas técnicas de crescimento, utilizando como matéria-prima o quartzo natural. A obtenção de quartzo cultivado tem tornado possível a obtenção de cristais de alta qualidade devido à possibilidade de controlar as inclusões de impurezas e/ou defeitos na sua estrutura cristalina.

## 1.3. IMPUREZAS E DEFEITOS NO QUARTZO $-\alpha$

Apesar do quartzo ser considerado um dos minerais mais puros encontrados na natureza [8], o mesmo apresenta em sua es trutura cristalina uma variedade de defeitos, tais como: "twin ning", imperfeições estruturais, inclusões macroscópicas e nota damente uma enorme e variada quantidade de impurezas, que influ enciam fortemente as propriedades físicas do material e obviamen te são responsáveis pelas várias restrições que o mesmo sofre nos diversos campos de aplicabilidade [9], mas especificamente na indústria eletrônica e na fabricação de fibras ópticas.

Inúmeras são as impurezas presentes na estrutura cristalina do quartzo, sendo citado na literatura os seguintes elementos: H, Li, Ne, Rb, Be, Mg, Ca, Ba, B, Al, Ge, Sn, Pb, Ag, Cu, Zn, Bi, Fe, Ni, Cr, Mn, Ti, Zn.

Uma das impurezas mais comumente encontradas no quartzo é o Al e acredita-se que tal elemento ocorre quase sempre em todas as variedades do quartzo [10], e em termos quantitativos é uma das impurezas mais importantes, juntamente com o Li, Na, Mg, Ca, Fe e F. Da mesma forma, a impureza H, determinada como OH é encontrada em todas as variedades de quartzo e tem sido estudada intensivamente a partir da comprovação de sua existência na es trutura cristalina do quartzo por Brunner, Woudratscheck e Laves [11], e principalmente por Kats [12].

As Tabs. 1.2 [8] e 1.3 [13] fornecem dados quantitativos de diversas impurezas encontradas em vários tipos de quartzo- $\alpha$  natural.

Variadas técnicas experimentais têm sido utilizadas para a determinação das impurezas no quartzo natural e sintético [14,23], sendo que as impurezas metálicas são determinadas através de análises espectroscópicas, podendo ser citadas a análise espectral de emissão, em alguns casos a fotometria de chamas e a

calorimetria e, em particular, a absorção infravermelha para de terminação da impureza não metálica H (OH).

Tabela 1.2 - Quartzo Natural Brasileiro - Grau eletrônico

Impureza	Intervalo Normal					
Impureza	(p.p.m./Si)					
Al	20 - 500					
Na	ND - 200					
Li	3 - 30					
Ca	10 - 30					
Mg	ND - 50					
Cu	ND					
Mn	ND - 30					
Cl	ND - 30					
К	ND - 10					
Н	ND - 60					
Fe	10 - 150					

Tabela 1.3 - Impurezas em vários tipos de Quartzo-α

								٠		-
Quartzo Rosa	nd	nd	(≅1000)	pq	(100-1000)	(25-3000)	(30-400)	1 70	10-300	30-100
Citrino	<1-1000	10-300	12-200	4- 55	10-800	10-350	<1 5	1- 60	10-300	6-700
Ametista	<1 15	<1-135	5- 75	3∸, 35	5-350	10-300	<1- 5	<1- 60	5-120	4-450
Quartzo Smoky	<1- 55	2-100	<1- 20	<8- 30	6-140	<1- 17	<1- 10	<1- 10	<1÷ 1.0	nd
Cristais de Rocha	<b>↓</b>	0.2-12	<1=: 8	<5-20	3-65	<1-16	<1-10	<1–10	<1 4	nd
Impureza	ж	Li	Na	X	A1	ĘH Ø	Ţì	Wn	My .	0)

Os valores são dados em ppm (partes por milhão)

### 1.4. APLICAÇÕES

O quartzo cristalino é amplamente utilizado na indús tria de equipamentos ópticos, mais especificamente na construção de prismas destinados a espectrômetros que operam na região do ultra-violeta do espectro eletromagnético, pelo fato de a presentar uma alta transmissão para comprimentos de onda abaixo de 2000 A°. Entretanto, devido às suas propriedades piezo-elétricas, o quartzo cristalino encontra na indústria eletrônica as suas mais significativas e importantes aplicações, sendo mais comumente donominado de quartzo grau eletrônico.

As primeiras aplicações práticas de quartzo grau ele trônico se deram por volta de 1922, quando Walter G. Cady [24] utilizou-se como controlador de frequência em circuitos oscila dores de rádio, tornando-o a partir de então um elemento im prescindível na indústria eletrônica, particulamente como controladores precisos de frequências, pois apresenta uma rara e excepcional combinação de propriedades físicas que o torna excepcionalmente ideal para tais finalidades. Só para termos uma idéia, sua elasticidade é tão perfeita que as vibrações mecânicas (induzidas pelo efeito piezo-elétrico contrário) destecris tal ocorrem praticamente com quase nenhuma perda de energia,

além disso é um isolante excepcional de tal forma que são míni mas as perdas dos elétrons no cristal vibrante.

Praticamente, toda a produção de quartzo grau ele trônico é destinada a fabricação de unidades cristalinas para serem utilizadas em circuitos de rádio-transmissores, circuitos telefônicos de rádio-frequência e como filtros em circuitos receptores com a finalidade de eliminar sinais diferentes das frequências desejadas e em incontáveis equipamentos de comunicações, tais como: televisores, auto-falantes, radares, etc.

Um novo campo de aplicações dos cristais de quartzo grau eletrônico é na indústria de relógios, mais especificamen te na construção de relógios eletrônicos controlados por oscilações destes cristais, o que torna possível manter a regularidade do tempo com um erro de apenas um segundo em um ano.

A indústria de vidros encontra no quartzo, a matéria -prima essencial para a obtenção de vidro de sílica. Dependendo do do processo utilizado na sua fabricação, o quartzo pode estar presente em quantidades que variam de 50 a aproximadamente 100% de toda a constituição do vidro de sílica. Este tipo de vidro apresenta propriedades mecânicas, elétricas, químicas estérmicas suficientemente estáveis, tornando-o economicamente

viável em inúmeras aplicações tecnológicas.

Devido ao seu baixo coeficiente de expansão térmica e alto ponto de fusão, os vidros de sílica são altamente resistentes às variações bruscas de temperaturas, podendo ser utilizado na fabricação de termômetros que operam acima de 1000°C.

São ainda empregados na fabricação de cadinhos e tubos destinados a processos de combustão, podendo ainda ser utilizado na fabricação de materiais ópticos, particularmente na fabricação de fibras ópticas.

## CAPÍTULO 2

## 2.1. TEORIA INFRAVERMELHA

composta molécula é A energia total de uma por energia translacional, rotacional, vibracional e eletrônica. Para efeito de simplificação, geralmente essas energias são con sideradas separadamente. Observa-se que as transições, envolven do energias de ordem eletrônica, normalmente dão origem a absor ção ou emissão nas regiões do ultravioleta e visível do espectro eletromagnético, enquanto que as transições entre os diferentes níveis de energia vibracionais e rotacionais podem originar espectros de emissão ou absorção em toda a região do melho. Assim, as transições que ocorrem entre determinados ni veis de energia originados da absorção ou emissão de "quantum" de luz bem definido são responsáveis pelo aparecimento das li nhas espectrais nos átomos e as denominadas bandas de absorção nas estruturas mais complexas, isto é, as moléculas.

Ao realizar um movimento vibracional, uma molécula poderá absorver radiação cuja freqüência está situada na região infravermelha intermediária do espectro eletromagnético.

A região infravermelha no espectro eletromagnético se estende aproximadamente entre os limites da frequência mais bai xa do espectro na região do visível (10000 cm<sup>-1</sup>) até da frequência mais alta na região de microondas (10 cm<sup>-1</sup>), do que do ponto de vista experimental é comum subdividir a re gião do infravermelho em três intervalos distintos: o intervalo que situa-se na região de 4000 cm<sup>-1</sup> a 200 cm<sup>-1</sup> é conhecido como a região fundamental ou intermediária do infravermelho. A região de baixa frequência que vai de 200 cm<sup>-1</sup> até o limiar da região de microondas é denominada de região longingua e o intervalo que se estende de 4000 cm<sup>-1</sup> até o limiar da região visível rece be o nome de região do infravermelho próximo. É importante lientar que essa divisão é feita de uma forma arbitrária, sendo os limites entre essas três regiões estabelecidos de acordo com os dispositivos utilizados na detecção da radiação a ser medida.

Devido ao movimento vibracional, os átomos de uma molécula são deslocados de suas posições de equilibrio passando a oscilar em torno das mesmas com uma determinada frequência de vibração. Da mesma forma, as cargas associadas a esses átomos oscilam com frequências idênticas, podendo provocar uma variação no momento de dipolo da molécula. Portanto, se a frequência da radiação infravermelha incidente sobre a molécula se iguala

àquelas das vibrações normais responsáveis pela variação no momento de dipolo da mesma, ocorrerá a absorção da radiação incidente e teremos o aparecimento das bandas de absorção nos registros dos espectros.

Para se obter uma variação no momento de dipolo, durante uma vibração normal, não é necessário que a molécula possua um momento de dipolo permanente.

Consideremos por exemplo, as duas vibrações normais da molécula linear  ${\rm CO_2}$ , mostrada esquematicamente nas Figs.2.1a e 2.1b.



No primeiro tipo de vibração (Fig. 2.1a), os dois átomo de oxigênio movem-se em fase afastando-se do átomo de carbo no no primeiro meio-ciclo de vibração, e em fase em direção ao átomo de carbono no próximo meio-ciclo. O momento de dipolo, que era zero por simetria para a configuração de equilíbrio, perma

necerá inalterado durante o ciclo completo de vibração. Assim , devido à ausência de oscilações do momento de dipolo, esse tipo de vibração não interage com a radiação infravermelha e consequentemente nenhuma banda de absorção é registrada.

Para o segundo tipo de vibração (Fig. 2.1b), os áto mos de oxigênio movem-se ambos em direção à direita, enquanto que o átomo de carbono se desloca para a esquerda, no primeiro meio-ciclo de vibração. No próximo meio-ciclo de vibração, as direções de movimentos dos átomos são invertidas. Observa - se que durante o ciclo completo de vibração a simetria molecular é quebrada (em consequência das alterações nos comprimentos das ligações de um átomo em relação à outro), resultando em um des locamento periódico do centro das cargas positivas em relação ao centro das cargas negativas e no aparecimento de uma varia ção periódica do momento de dipolo. Portanto, se a freqüência da radiação infravermelho incidente é igual a freqüência de vibração do momento de dipolo, ocorrerá a absorção dessa radiação.

As vibrações que estão associadas com as variações nos momentos de dipolo de um sistema são denominadas vibrações ativas no infravermelho, pois tais vibrações dão origem à absorção na região infravermelha do especto eletromagnético. Por ou

tro lado, as vibrações nas quais as variações dos momentos de dipolo são zero devido a simetria molecular são denotadas vibrações inativas infravermelhas.

As intensidades e formas das bandas vibracionais são de considerável importância na interpretação dos espectros e nas análises quantitativas. As intensidades das bandas na região infravermelha do espectro eletromagnético são diretamente proporcionais à probabilidade de que ocorra uma transição vibracio nal ou rotacional entre o estado fundamental de energia e algum estado excitado. Esta probabilidade, por sua vez, depende fundamentalmente do quadrado da taxa de mudança no momento de dipolo para uma vibração particular. Uma intensa banda, indica uma apreciável mudança no momento de dipolo dos átomos envolvidos durante uma vibração ou que muitos átomos ou grupos funcio nais no interior da molécula possuem a mesma energia vibracio nal.

# 2.2. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DO QUARTZO- $\alpha$

O espectro de absorção ótica de um cristal de quartzo livre de qualquer defeito ou impureza é mostrado na Fig. 2.2a.

[Ref. 25]. Este espectro é caracterizado por uma extensa região de alta transparência, que se inicia com a banda de absorção eletrônica próxima a 69000 cm<sup>-1</sup> e se extende até a região intermediária do infravermelho em torno de 3000 cm<sup>-1</sup>. Esta extensa região de transparência no espectro de absorção óptica torna o quartzo um material excepcional para a fabricação de diversos dispositivos ópticos de diferentes utilidades.

De 3000 cm<sup>-1</sup> abaixo, existem fortes absorções que se iniciam com os overtones e combinações de freqüências de 2500 cm<sup>-1</sup> até aproximadamente 1500 cm<sup>-1</sup>, passando através das vibrações fundamentais da rede e encerrando na vizinhança de 120 cm<sup>-1</sup>, onde se situa a última e forte banda de absorção fundamental da rede.

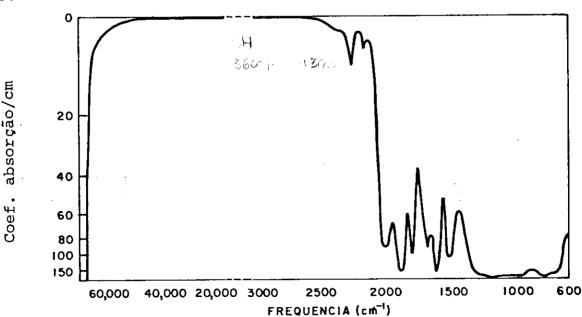


Fig. 2.2a - Espectro de absorção óptico do quartzo-α natural livre de qualquer defeito ou impureza

Evidentemente, tanto o quartzo natural como o sintético co apresentam em sua estrutura cristalina diferentes e varia das concentrações de impurezas que modificam consideravelmente o espectro de absorção desses cristais nas diversas regiões de transparências [26-29].

A região em torno de 3 microns é caracterizada por pos suir fortes bandas de absorção e tem sido objeto de inúmeros es tudos [30-38]. Kats [12] em extensivos estudos provou que a origem dessas bandas são devidas às vibrações de alongamento do grupo OH na vizinhança de diferentes impurezas presentes na rede. As bandas largas e fracas em torno de 3200 cm<sup>-1</sup> e 3300 cm<sup>-1</sup> estão presentes em todos os espectros de qualquer tipo de quart zo, e são atribuídos à overtones e combinações de freqüências das vibrações da rede Si-O [40,41]. As Figs. 2.2 e 2.3 descrevem os espectros de transmissão do intervalo de 4000 cm<sup>-1</sup> a 2500 cm<sup>-1</sup>, de duas amostras de quartzo natural utilizados em nosso trabalho e a Tabela 2.1 [Ref. 12] fornece todas as bandas observadas em quartzo natural no intervalo de 3000 a 3900 cm<sup>-1</sup>.

Uma vez que todas as absorções em torno de 3 microns na região do infravermelho do espectro eletromagnético são devido ao grupo OH, com exceção de algumas terem sido originadas na

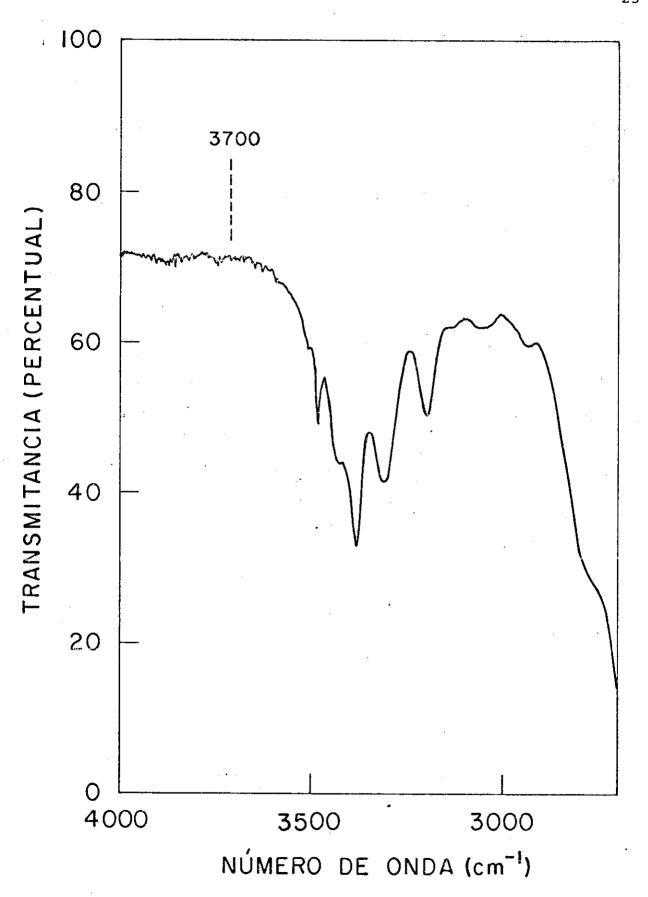


Fig. 2.2 - Espectro de absorção na região de 4000 a 2500 cm<sup>-1</sup>
para quartzo-α natural de primeira qualidade

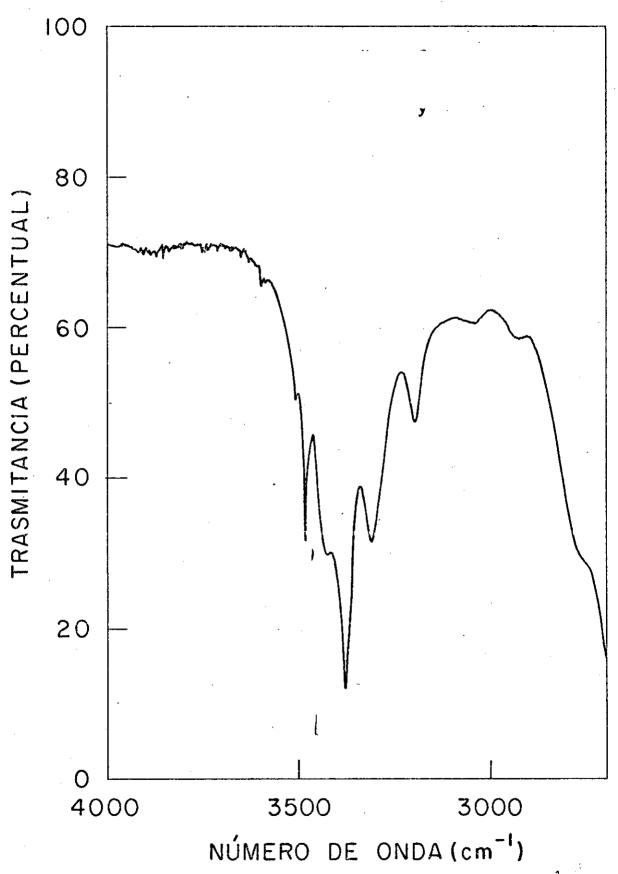


Fig. 2.3 - Espectro de transmissão na região de 4000 cm<sup>-1</sup> ou 2500 cm<sup>-1</sup> para quartzo-α natural de primeira qualidade.

Tabela 2.1 - Identificação das bandas de absorção no quarto- $\alpha$  natural na região em torno de 3 $\mu$ .

Frequência (cm <sup>-1</sup> )	OH associado com	Outros
3204	-	overtones ou combinações das vibr <u>a</u> ções da rede Si-O
3222	H <sup>+</sup>	
3240	H <sup>+</sup>	
3300	<del>-</del>	overtones ou combinações das vibr <u>a</u> ções da rede Si-O
3305	H <sup>+</sup>	•
3311	H <sup>+</sup>	
3371	H <sup>+</sup>	
3380	H <sup>+</sup>	
3382	Na <sup>+</sup>	
3396	Li <sup>+</sup>	
3400	Na <sup>+</sup> ,H <sup>+</sup>	
3414	K <sup>+</sup>	
3422	H <sup>+</sup>	
3435	H <sup>+</sup>	
3440	Li <sup>+</sup>	
3453	Na <sup>+</sup>	
3460	K+	
3462	H <sup>+</sup>	
3470	$^{\mathrm{H}^+}$	
3478	Li <sup>+</sup>	
3485	H <sup>+</sup>	
3510	Li <sup>+</sup>	
3513	Na <sup>+</sup>	
3520	Li <sup>+</sup>	
3534	Na <sup>†</sup>	
3538	K+	
3550	K <sup>+</sup>	
3556	Na <sup>+</sup>	
3567	K <sup>+</sup>	
3578	, K <sup>+</sup>	
3585	K <sup>+</sup> ,H <sup>+</sup>	
3610	к+	

segunda ordem dos fundamentais e levando em consideração a facilidade de obtenção dos espectros nessa região a técnica de espectroscopia infravermelha é ideal para o estudo quantitativo da impureza H descrita como OH.

## 2.3. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS ESPECTROS INFRAVERMELHOS

Comumente a técnica de espectroscopia infravermelha é mais frequentemente utilizada como uma ferramenta para análises qualitativas dos grupos funcionais das moléculas. Entretanto, es sa técnica experimental pode ser empregada em menor escala em análises quantitativas de inúmeros materiais.

As análises quantitativas realizadas através de espectrômetros cujo sistema de funcionamento é baseado no princípio de dois feixes, isto é, o espectrômetro de feixe duplo (como no nosso caso), são fundamentalmente baseadas na diminuição de energia que passa pela amostra comparada com a energia do feixe de referência. E esta variação de energia que é utilizada como parâmetro básico em uma análise quantitativa e cuja informação é obtida através da medida da grandeza física denominada Absorbância ou Transmitância.

As análises quantitativas são baseadas na aplicação de duas leis fundamentais, conhecidas como Lei de Lambert's e Lei de Beer's, as quais determinam a relação entre as intensidades da radiação incidente e transmitida por um meio absorvente. A seguir, descreveremos as duas leis acima referidas.

## Lei de Lambert:

Esta lei expressa a relação quantitativa entre a energia transmitida pela amostra em uma dada frequência e a sua expessura, isto é:

$$T = (I/Io) = \exp(-\alpha x) \qquad (2.1)$$

aplicando ln em ambos os termos de (2.1), temos:

$$\ln(I/Io) = -\alpha x \tag{2.2}$$

multiplicando ambos os termos de (2.2) por 1/2.303, podemos expressar (2.1) na sua forma mais utilizada:

$$A = \log I / I = Kx \tag{2.3}$$

onde  $K = 2.303 \lambda$ 

Comparando (2.1) com (2.3), podemos escrever:

$$A = log (1/T) = Kx$$
 (2.4)

ou  $K = 1/x \log (1/T)$ 

onde:

A = absorbância

T = transmitância ou fração da radiação transmitida pe la amostra

I = radiação transmitida pela amostra

Io = radiação incidente na amostra

K = coeficiente de absorção, que é função da frequên cia de radiação incidente

#### Lei de Beer:

Também conhecida como Lei de Beer's-Lambert's,ou Beer-Lambert-Bouguer, expressa a relação entre a radiação absorvida pela amostra, a sua concentração e o caminho percorrido pela radiação na amostra. A seguir, faremos a dedução para a Lei de Beer's.

Consideramos uma amostra qualquer de comprimento dx descrito na Fig. 2.4 e façamos incidir sobre a mesma uma radia ção de intensidade Io, que percorre o caminho dx, sendo absorvida de uma quantidade (-dIo) e transmitida com intensidade I.

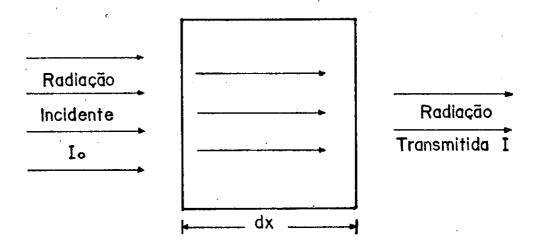


Fig. 2.4 - Radiação incidindo e passando através de um segmen to dx de uma amostra qualquer

Io = quantidade da radiação incidente em 1cm<sup>2</sup>/seg
-dIo = decréscimo na quantidade de radiação que passa por dx

dx = segmento diferencial da largura da amostra

I = quantidade da radiação transmitida pela amostra

Temos que o decréscimo da radiação que passa pela <u>a</u> mostra (-dIo) é proporcional a quantidade da radiação dispon<u>í</u> vel para a absorção (Io), e também ao número de moléculas presentes na amostra capaz de absorver radiação. Por sua vez, este número de moléculas é proporcional à concentração das moléculas absorventes (c) e a expessura da amostra (x). Assim, a radiação

absorvida pela amostra pode ser expressa como o produto de uma constante pela quantidade da radiação que incide na amostra (Io), a concentração (c) e ao comprimento da amostra (dx), isto é,

$$-dIo = kcIodx (2.5)$$

onde k é o fator de proporcionalidade expresso em unidades de l/g.cm ou em mol/l.cm e é denominado de coeficiente de absorvidade molar ou coeficiente de extinção molar. É importante sa lientar que k depende do tipo da amostra absorvedora e da freqüência da radiação incidente.

Integrando (2.5), podemos determinar o decréscimo to tal na intensidade da radiação incidenté:

$$\int_{T_0}^{I} \frac{dIo}{Io} = -\int_0^x kc dx \qquad (2.6)$$

$$- \ln \frac{I}{I_0} = kcx \tag{2.7}$$

que também pode ser expressa como:

$$\frac{I}{Io} = e^{-kcx}$$
 (2.8)

multiplicando a equação (2.7) em ambos os termos por 1/2.303 podemos expressar (2.7) em termos de logaritmo decimal:

$$1/2.303 \text{ In (I/Io)} = \frac{-k}{2.303} \text{ cx}$$
 (2.9)

$$-\log (I/Io) = \varepsilon cx \qquad (2.10)$$

$$\varepsilon = \frac{k}{2.303}$$

ou 
$$I = Io 10^{-\varepsilon CX}$$
 (2.11)

Substituindo (2.1) em (2.10), obtém - se a expressão usual para a lei de Beer's:

$$A = \varepsilon C x \tag{2.12}$$

onde:

ε = constante de absorção molar que é característica do material e da freqüência da radiação incidente expresso em (l/g.cm) ou (l/mol.cm).

c = concentração da amostra, dado em g/l ou mol/l

x = expessura da amostra (cm)

Os instrumentos utilizados para obtenção dos dados experimentais geralmente são construídos para fornecerem leituras em transmitância (T = I/Io), ou absorbância (A = log 1/T). Observa-se que devido a essas duas formas distintas de leitura, existem na literatura uma confusão com respeito a nomenclatura utilizada. Em vista disso, adotar-se-á a notação recomendada pela

#### IUPAC, que é a seguinte:

α = coeficiente de absorção neperiano

K = coeficiente de absorção decádico

k = coeficiente de absorção neperiano molar

ε = coeficiente de absorção decádico molar

Nos dois últimos casos, a concentração é mol/litro. Se a concentração é expressa em unidades de massa/li tro, a IUPAC recomenda a substituição dos símbolos k e ε por e  $\alpha$  , passando a ser denominados respectivamente de coeficiente de absorção neperiano específico e coeficiente de absorção decá dico específico. Observa-se que em muitos trabalhos determinações quantitativas através da utilização da técnica de espectroscopia infravermelho, o coeficiente de absorção K sido designado como coeficiente de extinção e os símbolos μ e α de coeficientes de extinção molar, sendo que também aparece literatura como coeficiente de absorção de Lambert's. Muitos ou tros termos têm sido utilizados para designar os coeficientes acima, provocando consideráveis confusões, devido ao fato de que uma mesma notação é designada para expressar grandezas físicas diferentes.

## 2.4. ANÁLISE QUANTITATIVA DE H NO QUARTZO- $\alpha$

A determinação quantitativa de H no quartzo- $\alpha$  na região de 3 microns do espectro eletromagnético com base nas expressões (2.1) e (2.12) pode ser expressa como:

$$c = \frac{Kmax}{\varepsilon}$$
 (2.13)

e 
$$c = \frac{\int K(\mathbf{y}) dv}{\int \epsilon(\mathbf{y}) dv}$$
 (2.14)

Apesar de ambas as expressões servirem para tal fim , é sempre aconselhável a utilização da expressão (2.14), isto de vido ao fato de que, a obtenção do valor máximo do coeficiente de absorção (Kmax), medido na banda onde ocorre a absorção ca racterística do elemento pode ser alterado por fatores tais co mo instrumentação, temperatura, etc., levando evidentemente a uma maior imprecisão no cálculo efetuado. Por outro lado, o uso da expressão (2.14), elimina esses problemas e assim a obtenção de K pode ser feita através da integração do coeficiente de absorção sobre todo o intervalo de freqüência que varre a banda , tornando os resultados mais confiáveis.

Definindo o coeficiente de absorção integral como:

$$\Delta = \int K(\mathbf{v}) \, d\mathbf{v} \tag{2.15}$$

e o coeficiente de absorção molar integral por:

$$I = \int \varepsilon(v) \, dv \tag{2.16}$$

e substituindo em (2.14), podemos escrever:

$$c = \frac{\Delta}{I} \tag{2.17}$$

Como vimos, a determinação de H no quartzo na região de 3 microns utilizando a técnica de absorção no infravermelho pode ser obtido através das expressões (2.13) ou (2.14), geral mente utilizando um valor de calibração para o coeficiente de absorção molar I dado por Brunner et al. [11] e cuja expressão é:

$$c = \frac{2}{3} \frac{\Delta}{14000} \text{ mol H/l}$$
 (2.18)

Embora na determinação de I para a expressão (2.18),o autor tenha encontrado um valor da ordem de I = 21000 cm<sup>-2</sup> por mol de H/l, ele utiliza para I um valor de 14000 cm<sup>-2</sup> por mol H/l e um fator multiplicativo de 2/3, supostamente para levar em consideração que a absorção é anisotrópica. Entretanto, observa-se que essa fator adicional é cancelado pelo fator 2/3 que o autor utilizou para obter o valor de 14000 cm<sup>-2</sup> mol H/l, con

sequentemente tornando o papel da anisotropia sem nenhum sign<u>i</u> ficado, logo é equivalente usar na expressão (2.18) o valor de 21000 cm<sup>-2</sup> por mol H/litro para I.

Bambauer [13] fornece uma expressão equivalente a (2.18), só que inclui o valor adicional  $f = \varphi \cdot 10^6/60 = 44000$ , com o intuito de converter a concentração C de mol H/litro em unidade de ppm, isto é, H/10<sup>6</sup> Si:

$$C = \frac{2}{3} \frac{\Delta}{14000} \frac{\varphi.10^6}{60} \text{ H/}10^6 \text{ Si} , \qquad (2.19)$$

sendo  $\varphi$  a densidade do quartzo.

Entretanto, Blasic [42] demonstrou que o valor de f na expressão dada por Banbauer estava incorreto, sendo o valor de f igual a:

$$f = \frac{60.10^6}{\varphi - 10^3} \approx 22.600$$
, tal que

$$C = \frac{2}{3} \frac{\Delta}{14000} \frac{60 \cdot 10^6}{\varphi \cdot 10^3} \text{ H/10}^6 \text{ Si} \qquad (2.20)$$

Sabemos que a absorção devido ao grupo OH na região infravermelha em torno de 3 microns é atribuída às transições vibracionais envolvendo os alongamentos vibracionais das liga

ções OH. Consequentemente, a intensidade na absorção depende da (orientação) distribuição de orientação do dipolos OH em relação ao vetor campo elétrico É da radiação infravermelha incidente. Assim, na determinação quantitativa de H é necessário levar em consideração a distribuição de orientação dos dipolos OH responsáveis pela absorção, bem como o estado de polarização e direção da radiação incidente na amostra.

Se e é o coeficiente de absorção molar para o caso em que as ligações OH são por hipótese todas paralelas ao vetor campo elétrico É de uma radiação plano polarizada e I O correspondente coeficiente de absorção molar integral, então o coeficiente de absorção molar integral, então o coeficiente de absorção molar para o caso em que as ligações OH não são paralelas a É pode ser escrito como:

e por extensão,

$$I = \gamma I$$

onde:

γ = fator de anisotropia ou de orientação, que leva.em consideração tanto a distribuição de orientação de OH bem como o estado de polarização da radiação incidente na amostra.

Paterson [43] propôs uma expressão para a determina ção quantitativa de H em quartzos e em vidros que leva exatamen te em consideração a distribuição de orientação de OH bem como o estado de polarização da radiação incidente na amostra. Este autor, fazendo uso de uma curva de I/Y em função de Y para as vibrações do grupo OH na região de 3 microns (Fig. 2.5), tanto no quartzo como em materiais vítreos, encontrou uma expressão para o coeficiente de absorção molar que não necessita de nenhum tipo de calibração prévia.

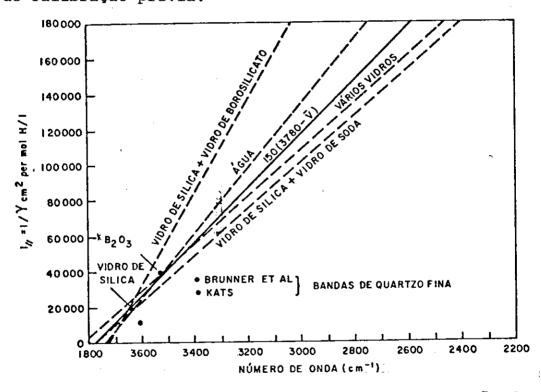


Fig. 2.5 - Intensidade de absorção do grupo OH na região de 3  $\mu$ m no  $\alpha$ -quartzo e outros compostos, expresso como coe ficiente de absorção molar integral (decadico) para OH idealmente orientado I = I/ $\gamma$ , com  $\gamma$  sendo o fa tor de anisotropia.

Tomando como base estas curvas, o mesmo traçou uma reta média cuja equação é da forma:

 $I = \gamma 150 (3780 - \overline{v})$ 

(2.22)

e substituindo na equação (2.17), obteve-se a seguinte expressão para o cálculo da concentração de OH.

$$C = \frac{22600}{\gamma.150} \int \frac{K(\overline{\nu}) d\overline{\nu}}{3780 - \overline{\nu}} H/10^6 si (ppm) \qquad (2.23)$$

onde:

$$K(y) = \frac{1}{x} \log \frac{1}{T}$$

com:

x = expessura da amostra

T = transmitância registrada para uma determinada fre quência

 $\gamma$  = fator de anisotropia

## 2.5. O FATOR DE ANISOTROPIA

Admitamos que a atenuação da amplitude da radiação de vido às transições envolvendo os alongamentos vibracionais do grupo OH, seja proporcional à componente do vetor campo elétrico paralelo ao dipolo OH. Então, se  $\theta$  é o ângulo entre o dipolo OH e o vetor  $\vec{E}$  da radiação incidente, a atenuação na amplitude será proporcional a  $\cos\theta$ , e o coeficiente de absorção (relacionado à intensidade), será proporcional a  $\cos^2\theta$ . O fator de

orientação será expresso como o valor médio de cos<sup>2</sup>θ para uma dada distribuição de orientação de OH e para uma determinada polarização da radiação incidente. Alguns valores particulares de γ para a distribuição de orientação de OH rotacionalmente si métrica em relação ao eixo c do quartzo são dados na Tabela 2.2 (Ref.43].

DISTRIBUIÇÃO ORIENTAÇÃO DE OH	DIREÇÃO DE INCIDEN <b>CIA</b> RADIAÇÃO	POLARIZAÇÃO ·	FATOR DE ORIENTAÇÃO
isotrópica	qualquer	qualquer	1/3
OH a qualquer	IIC	qualquer	. 1/2 Sen <sup>2</sup> e
ângulo com	ТС	ñ polarizada	1/2 cos e +1/4 señe
o eixo C		IIC	cos²e
		TC	ı∕2 sen <sup>2</sup> e

Tab. 2.2 - Fatores de orientação para cristais uniaxiais

#### CAPÍTULO 3

### 3.1. INSTRUMENTAÇÃO

Para a obtenção dos dados experimentais esteve à nossa disposição o espectrômetro Perkin Elmer, modelo PE-180.

O modelo PE-180 é composto de duas unidades básicas:

A unidade eletrônica e de registro, e a óptica e de acessórios.

O mesmo pode operar tanto no modo de feixe único, "single-beam"

ou no modo de feixe duplo, "double-beam". Apresenta automatização em várias funções, tais como: mudança nas redes de difração, filtros, término da operação de varredura, etc., e possui um banco de memória com capacidade de armazenar até quatro conjuntos distintos de valores de varredura. Abaixo, descreveremos suscintamente as características dos principais dispositivos do PE-180.

## 3.1.a. FONTES DE RADIAÇÃO

Este modelo possui duas fontes distintas de radia ção; a globar e a de mercúrio.

A fonte globar é utilizada em medidas no intervalo compreendido entre 4000 cm<sup>-1</sup> a 100 cm<sup>-1</sup>, apesar de seu uso ser mais eficiente em medidas até 180 cm<sup>-1</sup>. Por sua vez,a fonte de mercúrio é mais comumente utilizada em medidas no infra vermelho distante.

### 3.1.b. DETETORES

Para converter a radiação infravermelha em sinal <u>e</u> létrico, o PE-180 é provido de dois detetores, o termopilha e o TGS. O detetor termopilha é preferencialmente utilizado na região de 4000 cm<sup>-1</sup> a 250 cm<sup>-1</sup>. O mesmo é composto basicamen te de uma associação de termopares em série, cujo sinal é or<u>i</u> ginado a partir de uma voltagem que é gerada quando as junções estão a diferentes temperaturas. O TGS é composto de um cristal piroelétrico "sulfato de triglicina", e de um pré-amplificador, sendo ideal para medidas abaixo de 525 cm<sup>-1</sup>.

#### 3.1.c. POLARIZADORES

A utilização de polarizadores no espectrômetro nos permite fazer medidas de polarização e análise de amostras

opticamente orientadas. Os elementos polarizadores do PE-180 são compostos de dois tipos de substratos: brometo de prata (AgBr), e polietileno. Esses polarizadores são posicionados na entrada da fenda S-1 (Fig. 3.1). O ajustamento do ângulo de polarização é feito através de um dos controles localizados na unidade óptica, sendo graduado de 5 em 5 graus evariam do desde -45 até 90 graus. Se o ajuste é colocado em 0 graus, a direção de polarização será vertical e para 90° graus teremos a direção horizontal.

O elemento polarizador com substrato de AgBr é utilizado na região espectral de 4000 cm<sup>-1</sup> a 286 cm<sup>-1</sup>, enquanto que o elemento polarizador com substrato de polietileno é usa do em medidas cuja região espectral situa-se entre 667 cm<sup>-1</sup> e 32 cm<sup>-1</sup>.

## 3.1.d. FILTROS E REDES DE DIFRAÇÃO

O PE-180 é dotado de um sistema automático que permite a utilização de filtros e redes de difração nos intervalos onde se encontram as frequências das radições desejadas.

Os filtros, num total de 15, são filtros de interfe

rência do tipo passa banda para grandes comprimentos de onda, sendo caracterizados por serem complementamente transparentes nas freqüências ideais e rejeitarem radiações que porventura apresentem comprimentos de onda menores ou de ordens mais altas das freqüências ideais.

As redes de difração, em número de 5, cobrem toda a região espectral que vai de 4000 cm<sup>-1</sup> a 125 cm<sup>-1</sup>, estando localizadas na unidade óptica, dispostas em um sistema de car socel. Abaixo, temos os intervalos de operação das redes nas diferentes regiões espectrais:

Rede	Interva	lo	(cm <sup>-1</sup> )
1	4200	_	2000
2	2100	_	1000
3	1050	÷	500
4	515	_	250
5	262.5	_	125

Entretanto, através de um acessório adicional, pode-se utilizar mais duas redes que permitem extender as medi das até 32 cm $^{-1}$ .

#### 3.1.e. SISTEMA OPTICO DO PE-180

Na Fig. 3.1 temos que um feixe de radiação infraver melha é emitido pela fonte Globar F1 ou pela fonte de rio F2. Após a emissão, este feixe será direcionado por série de espelhos planos e toroidais (M-1,M-2,M-3,M-4 e M-5), para um obturador do tipo Chopper CH-1 que opera com uma quência de 15 Hz e separa o feixe incidente em duas tes. A primeira corresponde ao raio de referência Io, e a gunda ao raio I que passará pela amostra. Entretanto, como os caminhos ópticos para ambos os raios I e Io são idênticos, amostra poderá ser colocada em qualquer um dos caminhos onde passará I e Io. Após passar pelo compartimento da tra, os feixes I e Io serão direcionados pelos espelhos M-9', M-10', M-9 e M-10, respectivamente, para o chopper 2 que, ope rando com uma frequência de 30 Hz atuará nos dois feixes, re sultando em um único feixe.

Após passar pelo chopper 2, o feixe resultante é transferido através de uma outra série de espelhos planos e tiroidais (M-12,M-13,M-14 e M-15), para a fenda S-1 de um mo nocromador "single-pass". De S-1, o feixe é difratado por uma das redes de difração (ver item c) e enviado à fenda S-2 ,

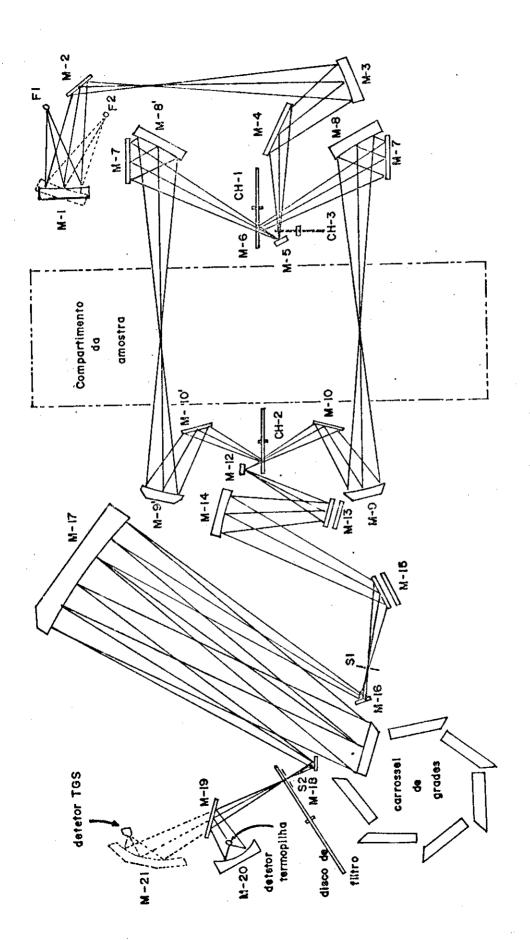


Fig. 3.1. - Sistema Óptico do PE-180

passando a seguir por um dos filtros (ver item d) e por fim, depois de ser refletido pelos espelhos M-19 e M-20 (para o caso do detetor termopilha), ou pelo espelho M-21 (para o detetor TGS), o feixe resultante incidirá no detetor de radiação, sendo transformado em um sinal elétrico.

#### 3.2. SELEÇÃO E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

O quartzo brasileiro, considerado de alta qualidade, é encontrado na forma de gemas; entretanto, sabe-se que a produção brasileira de quartzo destinada ao consumo interno e externo, e em sua maior parte produzida na forma de lascas e dependendo de sua qualidade são classificados comercialmente como de 19, mistas, 29, 39, 49, etc.

As lascas, consideradas de 1ª, são cristais de alta qualidade derivados de gemas e são utilizados na indústria e letrônica. As lascas mistas são também derivadas de gemas; en tretanto, são caracterizadas por possuirem defeitos ópticos tais como "twinns", o que implica na sua não utilização na indústria eletrônica, sendo comumente destinadas às indústrias de quartzo fundido. As lascas de 3ª e 4ª são usualmente utili

zadas como matéria-prima para a fabricação de quartzo sintético e as lascas de 5ª e 6ª são destinadas à produção de silício de grau metalúrgico.

Apesar do Brasil ser o maior produtor mundial de quartzo natural, a classificação descrita acima para o quartzo é feita através de simples inspeção visual, não existindo no Brasil nenhum critério ou método científico utilizado com tal propósito. Assim, dentro do objetivo do nosso trabalho, foram selecionados para estudos cristais de jazidas localizadas nos estados de Minas Gerais e Bahia.

Para a analise das amostras, os seguintes procedimentos foram adotados:

- 3.2.1. Selecionamos lascas de 1ª, 2ª, 3ª e mista, proveninientes de duas jazidas localizadas no estado de Minas Gerais, que foram cortadas com espessura da ordem de 10 mm, com o objetivo de fazer-se um estudo comparativo em termos de concentração de OH entre as mesmas.
- 3.2.2. Para uma melhor compreensão da distribuição de H em diferentes pontos de uma mesma amostra, foi cortada uma placa

de 12 x 7 x 1 cm<sup>3</sup> de 1ª qualidade proveniente da Bahia.

- 3.2.3. Com o intúito de estudarmos a orientação dos dipo los OH nos cristais, preparamos amostras de gemas provenien tes da Bahia, que foram cortadas em forma cúbica e atraves da espectroscopia de raio X, orientadas cristalograficamente.
- 3.2.4. Foram utilizadas amostras de quartzo sintético produzido pela Toyo do Japão, vidro de sílica amorfo suprasil e homosil, com concentrações de H conhecidas, com a finalidade de testar o método de cálculo utilizado. Todas as amostras foram cortadas com serra de diamante e polidas com pasta de diamente.

#### 3.3. MEDIDAS

Todas as medidas foram registradas na região compr<u>e</u>

endida entre 4000 cm<sup>-1</sup> a 2500 cm<sup>-1</sup>, adotando-se os seguintes procedimentos experimentais:

- Calibração do instrumento através da utilização de um filme de polietileno.
- 2. Ajustamento dos parâmetros operacionais do instrumento para a região medida, de acordo com o manual do PE-180.

Os registros dos espectros foram realizados em  $v\underline{\hat{a}}$  rias etapas:

Inicialmente, obtivemos os espectros de todas as <u>a</u> mostras à temperatura ambiente, utilizando radiação não pol<u>a</u> rizada.

Para as amostras orientadas cristalograficamente, além dos espectros utilizando radiação não polarizada, foram obtidos espectros utilizando radiação polarizada paralela e perpendicular às direções X, Y e Z dos mesmos. Como elemento polarizador, foi utilizado o brometo de prata AgBr, por ser ideal para a região de medida.

A Fig. 3.2 descreve as várias situações possíveis de tal medida.

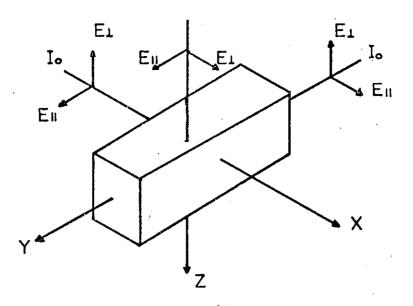


Figura 3.2

As direções da radiação incidente em relação à orientação do cristal são designadas por Io-X, Io-Y e Io-Z. As notações E|| e E| se referem à polarização da radiação infravermelha utilizada na obtenção dos espectros. Nos registros dos espectros, a notação E|| e E| refere a radiação polarizada, cuja componente do campo elétrico é paralela ou perpendicular às fendas do espectrômetro respectivamente. Se o controle de polarização é girado de 90°, a componente de campo elétrico muda de E|| para E| ou vice-versa. Deve-se enfatizar que neste tipo de experimento, a radiação não polarizada passa inicialmente pela amostra para depois passar pelo polarizador, que está posicionado na entrada da fenda B1 como na Fig. 3.1.

#### 34. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A concentração de H em todas as amostras analisadas foram obtidas a partir da expressão (2.23), utilizando o méto do de cálculo numérico e o sistema VAX-11/780. A funcionalida de do programa elaborado para tal fim, foi antes testado atra vés do cálculo da concentração de H das amostras descritas no item 3.2.4 e comparado com os resultados conhecidos. A confron tação entre os dados obtidos por nós com os dos fornecidos , apresentaram excelentes concordâncias, mostrando a funcionalidade do programa elaborado.

Todos os resultados são expressos em H/10<sup>6</sup>Si, ou se

## 3.4.1. <u>DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE H EM AMOSTRAS ORIEN</u> TADAS CRISTALOGRAFICAMENTE

Para realizarmos este estudo, selecionamos uma gema proveniente do estado da Bahia e escolhemos um cristal na forma cúbica conforme descrito no item 3.2.1. Este estudo foi realizado através das seguintes etapas:

1. Registros dos espectros à temperatura ambiente

utilizando radiação não polarizada incidindo-a ao longo das direções X, Y e Z na amostra.

2. Registro dos espectros à temperatura ambiente com radiação polarizada paralela e perpendicular ao longo das direções X, Y e Z.

Para calcularmos a concentração de H em amostra orientada dois fatores devem ser levados em consideração:

Q primeiro deles diz respeito à forma e direção da radiação incidente da amostra e o segundo está relacionado ao ângulo que os dipolos OH (responsáveis pela absorção da radiação infravermelha) fazem com o eixo óptico do cristal.

# 3.4.2. CÁLCULO DA CONCENTRAÇÃO DE H CONSIDERANDO DISTRIBUI ÇÃO ISOTRÓPICA PARA OS DIPOLOS OH

Se a distribuição de orientação dos dipolos OH no cristal é isotrópico, isto é, se não existe uma direção preferencial de orientação para os mesmos, da Tab. 2.1 teremos que o fator de anisotropia γ independente da natureza da radiação e direção de incidência será igual a 1/3.

Partindo da suposição de que a distribuição de ori

entação dos dipolos OH no cristal seja anisotrópica, vamos de terminar a concentração de H em nossa amostra orientada, utilizando radiação não polarizada e registrando os espectros nas direções X, Y e Z da mesma, esperando que a menos dos possíveis erros experimentais o resultado da concentração de H na amostra será igual qualquer que seja a direção de incidência da radiação infravermelha.

A Tab. 3.1 expressa os resultados da concentração de H considerando a distribuição dos dipolos OH isotrópicos.

A análise desses resultados, mostra que, quando a concentração é calculada utilizando radiações nas direções X e Y, os valores determinados são bastante próximos. Por outro lado, se o cálculo da concentração de H é realizado com radiação incidindo na direção Z da amostra, obtém-se um resultado bastante diferente daqueles nos quais a radiação incide nas direções X e Y.

Se em vez de luz não polarizada, utilizarmos radia ção polarizada paralela e perpendicular às direções X, Y e Z do cristal, novamente obtém-se resultados diferentes para a concentração de H conforme podemos verificar na Tab. 3.2.

Como os resultados do cálculo da concentração na <u>a</u> mostra, devem ser iguais, a hipótese da existência de isotro pia para a distribuição de orientação dos dipolos OH no cristal não é válida, significando que existe uma anisotropia na distribuição de orientação dos dipolos OH. Assim, o fator de 1/3 não pode ser utilizado na determinação de H em amostras orientadas e sim os fatores de orientação que levam em consideração a anisotropia na distribuição de orientação de OH, bem como a direção da radiação incidente, conforme dados na Tab.

Este caráter anisotrópico na distribuição de OH tam bém pode ser visto nas Figs. 3.3 e 3.4, que descrevem respectivamente os espectros de transmissão obtidos com radiação polarizada e não polarizada incidente nas direções X, Y e Z da a mostra, ou das Tabs. 3.3, 3.4 e 3.5, que fornecem os resultados numéricos obtidos a partir das medidas experimentais do coeficiente de absorção , para radiação polarizada e não polarizada.

Devido à característica anisotrópica apresentada pe la distribuição de orientação dos dipolos OH, podemos sugerir que existe uma direção preferencial "média" para as ligações OH, que farão um determinado ângulo "médio" com o eixo de si

metria do cristal, mais especificamente o eixo z ou equivalente en eixo óptico c.

Dos argumentos expostos no parágrafo anterior, a es colha da expressão de Paterson [43] para a determinação quantitativa de H é a mais aconselhável, pois como vimos na seção 2.4, apesar de existirem outras expressões para tal finalida de [11,13,42], a fórmula de Paterson é a única que leva em con sideração a anisotropia na distribuição dos dipolos OH, atra vés do fator de orientação.  $\checkmark$ 

Segundo Paterson, se a radiação infravermelha incidente na amostra não está polarizada, os fatores de orientação para cada uma das direções X, Y e Z de incidência serão dados respectivamente por  $1/2\cos^2\alpha + 1/4\sin^2\alpha$ ,  $1/2\cos^2\alpha + 1/4\sin^2\alpha$  e  $1/2\sin^2\alpha$ . Por outro lado, se é utilizada radiação polarizada na medida e a direção de incidência é perpendicular ao eixo óptico do cristal, teremos que: se a radiação é polarizada paralela a c, o fator de anisotropia será igual a  $\cos^2\alpha$  e para o caso em que a polarização é perpendicular ,  $1/2\sin^2\alpha$ .

Assim, se o ângulo α que os dipolos fazem com o ei xo óptico é conhecido, os fatores de orientação podem ser de terminados e a concentração de H na amostra calculada.



## 3.4.3. DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO "MÉDIO" a

Como conhecemos a forma e a direção de incidência da radiação, bem como a expressão para o respectivo fator de orientação a ser utilizado no cálculo da concentração de H, poderemos determinar o ângulo "médio" que os dipolos fazem com o eixo óptico do cristal.

Se a concentração de H é calculada utilizando radia ção não polarizada incidindo na direção X do cristal e utilizando o respectivo fator de anisotropia dado na Tab. 2.1, podemos escrever:

$$C = \frac{22.600}{(1/4 \sin^2 \alpha + 1/2 \cos^2 \alpha) 150} \int \frac{K(\tilde{\nu}) d\tilde{\nu}}{3780 - \tilde{\nu}}$$
 (3.1)

Substituindo o valor da integral dada na Tab. 3.5 e efetuando as operações algébricas ficamos:

$$C = \frac{40.98}{-(1/2 \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)}$$
 (3.2)

por outro lado, se a medida é feita com a radiação incidindo na direção Z e lembrando que o fator de orientação para este caso é  $1/2 \, {\rm sen}^2 \alpha$ , a concentração será dada pela se guinte expressão:

$$C = \frac{22.600}{150(1/2 \text{ sen}^2 \alpha)} \int \frac{K(\bar{\nu}) d\bar{\nu}}{3780 - \nu}$$
 (3.3)

Substituindo o respectivo valor da integral dada na Tab. 3.5, ficamos com

$$C = \frac{66.6}{\sin^2 \alpha} \tag{3.4}$$

Uma vez que a expressão utilizada na determinação quantitativa de H está relacionada com a concentração total na amostra e desde que a forma de como a medida está sendo feita é levada em consideração no respectivo fator de anisotropia, as expressões (3.2) e (3.4) darão o mesmo resultado para o cálculo de H.

Igualando (3.2) e (3.4), podemos determinar o ângulo procurado. Fazendo isto teremos:

$$\frac{40.98}{1/2 \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{66.6}{\operatorname{sen}^2 \alpha}$$

que é igual a:

$$\frac{\sin^2\alpha}{1/2 \sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = 1.625$$

Disto ficamos que

$$\alpha \approx 71^{\circ}$$

O ângulo também pode ser determinado utilizando radiação polarizado paralela e perpendicular ao eixo óptico do cristal.

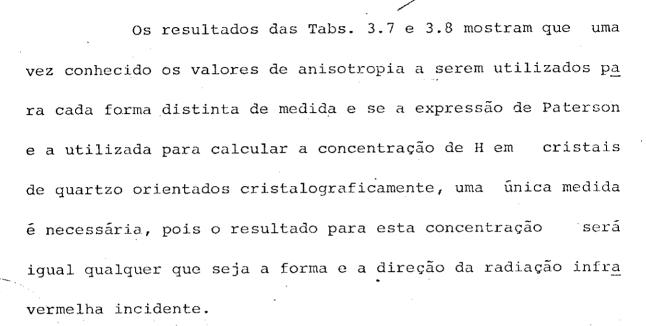
Se a incidência é ao longo da direção X e seguindo o mesmo procedimento do parágrafo anterior, o ângulo encontra do é de aproximadamente 70° e de 71° para o caso em que a direção de incidência é ao longo da direção Y.

Tomando a média dos três resultados obtidos, fica mos que o ângulo médio será aproximadamente igual a 71°.

Determinado o ângulo "médio" que os dipolos fazem com o eixo óptico do cristal, podemos calcular os respectivos fatores de orientação para cada uma das situações de medida descrita na Tab. 2.1 e com isto podermos determinar a concentração de H na amostra.

A Tab. 3.6 expressa os resultados para os fatores de orientação calculados com α igual a 71° e as Tabs. 3.7 e 3.8 apresentam os resultados finais do cálculo da concentração de H utilizando para cada caso o respectivo fator de anisotro

pia dado na Tab. 3.6.



#### 3.4.4. VARIAÇÃO LOCAL DE H EM PLACA DE QUARTZO

Com o objetivo de estudarmos a variação local de H em uma única amostra, escolhemos uma lasca de quartzo de 1º qualidade proveniente do estado da Bahia. A mesma foi cortada com dimensões da ordem de 12 x 7 x 1 cm<sup>3</sup>. Foram escolhidos quinze pontos distintos da placa para o mapeamento de tal forma que os pontos se distanciavam entre si por 2 cm.

Todos os espectros foram registrados à temperatura ambiente, utilizando radiação infravermelha não polarizada .

Os valores da concentração de H em p.p.m./10<sup>6</sup>Si para os 15

pontos analisados, são dados na Fig. 3.5.

Os resultados mostram uma variação de H de ponto a ponto, estando entre um mínimo de 41 p.p.m. e um máximo de 92 p.p.m., isto é, variando por um fator da ordem de 2. É evidente desse mapeamento, que a distribuição da impureza de H no cristal ocorre de forma bastante irregular, mostrando que é possível em uma única amostra obter cristais com diferentes graus de pureza com respeito a H.

Em um dos poucos trabalhos existentes na literatura acerca da variação local de H, Chakraborty e Lehmann [36] <u>a</u> presentam para duas placas de quartzo brasileiro uma variação de H bem maior do que a encontrada por nós. Na primeira placa com dimensões de 6 x 8 cm², o fator de variação da impureza H se encontra em torno de 28, com um valor mínimo de 4 p.p.m. e um máximo de 114 p.p.m. Para a segunda placa, com dimensões de 4.5 x 6.0 cm², o fator de variação de H é em torno de 4.5, com um valor mínimo de 70 p.p.m. e um máximo de 316 p.p.m. Seus resultados são dados nas Figs. 3.6 e 3.7.

#### 3.4.5. A CONCENTRAÇÃO DE H EM LASCAS DE 19, 29, 39 e MISTAS

Para fazermos um estudo comparativo em termos de

impureza H nas amostras classificadas comercialmente como de 1ª, 2ª, 3ª e mistras, selecionamos um grande número de amos tras de duas jazidas do estado de MG, mais especificamente de Ribibiu e Limoeiro. Todos os espectros foram registrados à temperatura ambiente com radiação infravermelha não polariza da.

A Tab. 3.9 expressa os resultados das amostras ana lisadas e as seguintes observações podem ser feitas:

- I. Para as lascas consideradas de 1ª qualidade, a concentração de H nas amostras de ambas as jazidas apresentam valores bastante próximos entre si, sendo a concentração sempre menor do que 70 p.p.m. para todas as amostras analisadas.
- II. Para as lascas mistas, a concentração de H nas amostras de ambas as jazidas quando comparadas com as lascas de 1ª qualidade não apresentam diferenças significativas entre si, logo as lascas mistas podem ser consideradas como material de alta qualidade se o parâmetro H é utilizado co como classificação, pois a única diferença é que

- a mesma apresenta em sua estrutura cristalina d $\underline{\underline{e}}$  feitos visuais.
- III. Para as lascas de 2ª e 3ª qualidades, a concentração de H nas amostras de ambas as jazidas diferenciam-se significativamente. As lascas de 3ª qualidade da jazida de Limoeiro apresentam em termos de H, um grau de pureza bem mais acentua do do que a de Ribibiu, acontecendo o contrário para as lascas de 2ª qualidade.

DIREÇÃO DE INCIDÊNCIA	NATUREZA DE POLARIZAÇÃO		CONCENTRA- ÇÃO H(ppm)
×	NÃO POLARIZADA	1/3	62
Y		1/3	59
Z		· 1/3	IOI

Tab. 3.1 - Resultado da Concentração de H admitindo distribuição isotrópica de OH, utilizando radiação não polarizada.

DIREÇÃO DE INCIDÊNCIA	NATUREZA DE POLARIZAÇÃO	FATOR DE ORIENTAÇÃO	CONCENTRA- ÇÃO H(ppm)
×	IIC	1/3	25
Y	II C	1/3	23
×	ŢС	1/3	96
Y	TC	1/3	98
Z	11 X	1/3	99
Z	IIY	1/3	102

Tab. 3.2 - Resultado da Concentração de H admitindo distribuição isotrópica, utilizando radiação polarizada | e L as direções X, Y e Z do cristal

DIREÇÃO DE INCI- DÊNCIA RADIAÇÃO		RESULTADO DA INTEGRAL
X	4.095	0.201
Υ	4.183	0.214

Tab. 3.3 - Resultados experimentais com radiação polarizada  $\bot$  a C

DIREÇÃO DE INCI- DÊNCIA RADIAÇÃO		RESULTADO DA INTEGRAL
X	1.167	0.054
Y	1.106	0.050

Tab. 3.4 - Resultados experimentais com radiação polarizada | a C

DIREÇÃO DE INCI- DÊNCIA RADIAÇÃO	COEFICIENTE DE ABSORÇÃO	RESULTADO DA INTEGRAL
X	2.584	0.136
Y	2.694	0.129
Z	4.314	0.221

Tab. 3.5 - Resultados experimentais com radiação não polarizada

	DIREÇÃO DE INCIDÊNCIA	POLARIZAÇÃO	FATOR DE ANISOTROPIA
DISTRIBUICÃO	Oll	dnajdner	0.44
DE OH COM	ЭТ	ñ polarizada	0.28
M ANGIII O K	27	Oll	0.10
DE 71°	υT	27	0.44

Tab. 3.6 - Resultados para os fatores de orientação, calculados à partir do resultado experimental obtido para  $\alpha$ 

DIREÇÃO DE INCIDÊNCIA	POLARIZAÇÃO	FATOR DE	CONCENTRAÇÃO DE H(ppm)
X	não	0.28	73
Y	polarizada	0.28	70
Z		0.44	76

Tab. 3.7 - Resultado da concentração de H, levando em considera ção a anisotropia na distribuição de OH, com radiação não polarizada

			_
DIREÇÃO DE INCIDÊNCIA	NATUREZA DE POLARIZAÇÃO	FATOR DE ORIENTAÇÃO	CONCENTRA- ÇÃO H(ppm)
X	IIC	0.10	81
Y	IIC	0.10	75
×	ТС	0.44	69
Y	TC	0.44	73
Z	IIX	0.44	74
Z	ШY	0.44	76

Tab. 3.8 - Resultado da concentração de H, levando em considera ção a anisotropia na distribuição de OH, com radiação polarizada

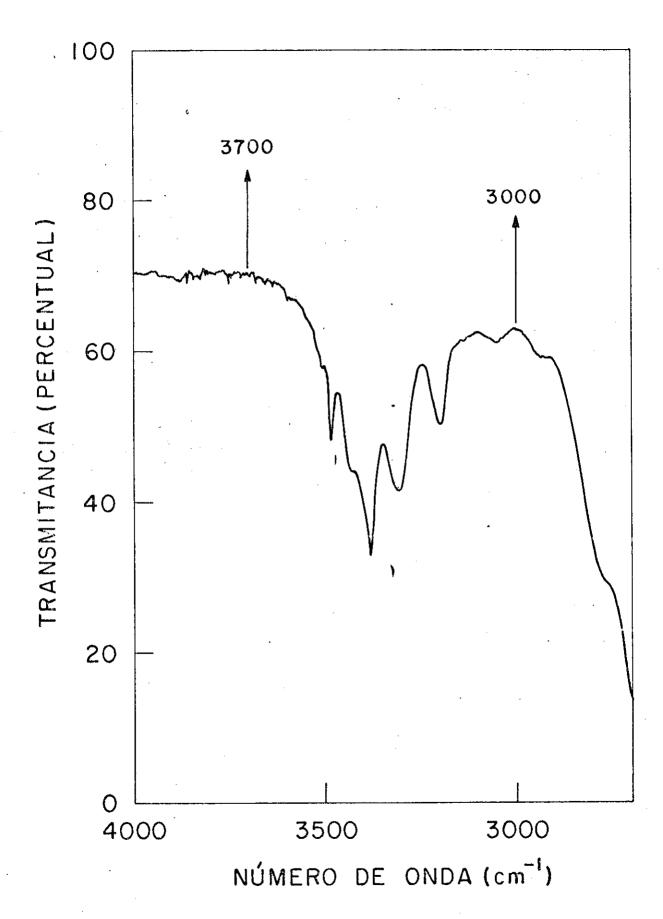


Fig. 3.3 - Espectro de transmissão com radiação não polarizada em um cristal de α-quartzo de 1ª qualidade

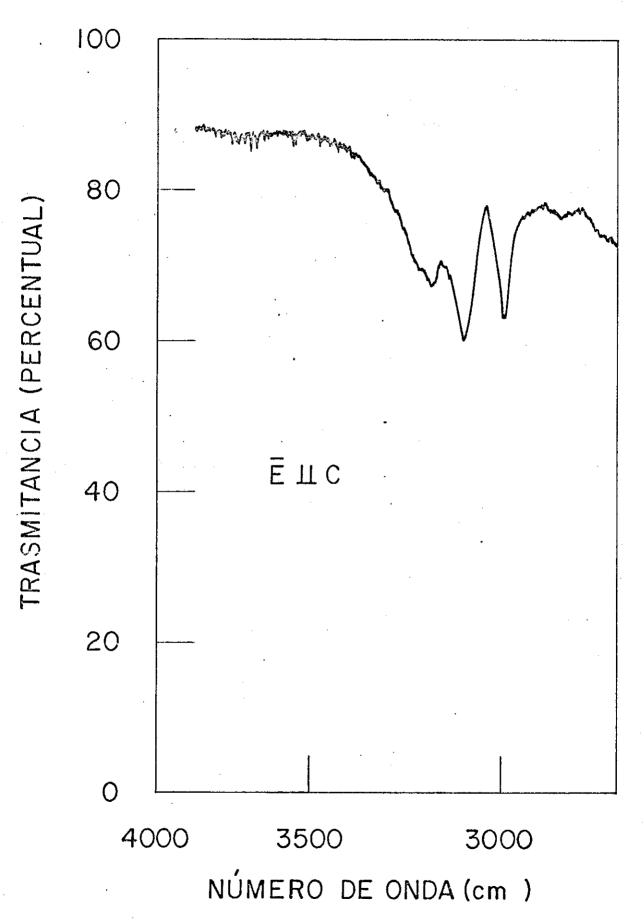


Fig. 3.4a - Espectro de transmissão polarizado paralelo ao eixo óptico de um cristal de  $\alpha$ -quartzo de 13 qualidade

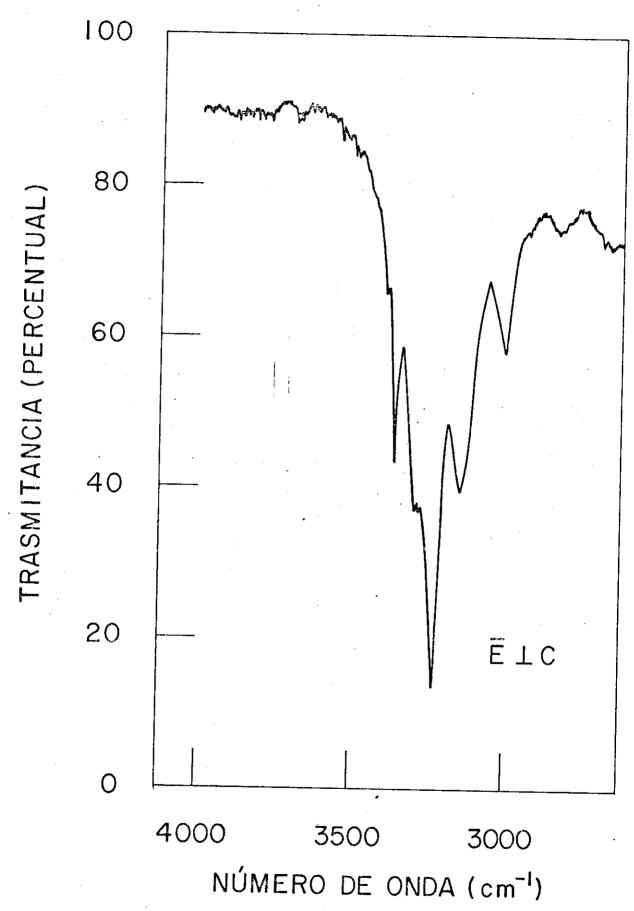


Fig. 3.4b - Espectro de transmissão polarizado perpendic**u**lar ao eixo óptico de um cristal de  $\alpha$ -quartzo de 1ª qualidade

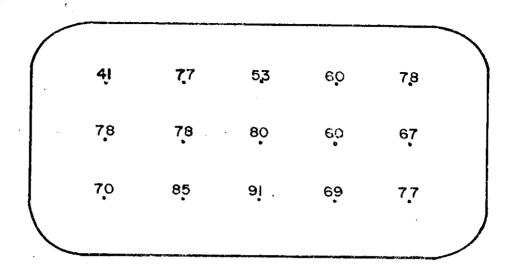


Fig. 3.5 - Resultado do mapeamento de uma placa de  $\alpha$ -quartzo brasileiro de 1ª qualidade proveniente da Bahia.

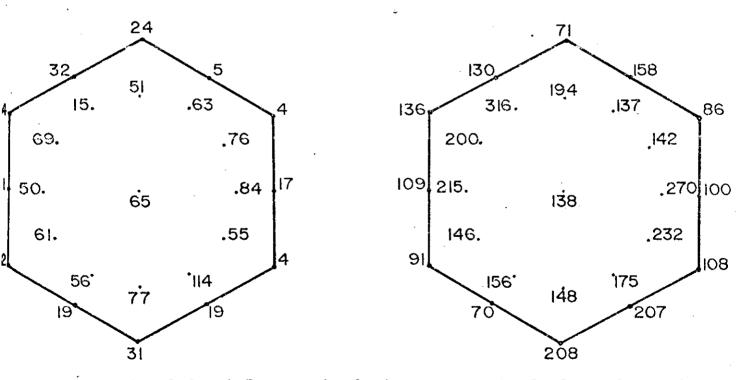


Fig. 3.6 e 3.7 - Resultado do mapeamento de duas placas de  $\alpha$ -quartzo brasileiro de acordo com Chukra • borty and Lehmann

CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL	AMOSTRA	CONCENTRAÇÃO DE H
	L1L-1	32
	L1L-2	36
1ª Qualidade	L1L-3	42
	L1L-4	57
	L1L-5	65
	L1R-1	21
Lasca de	L1R-2	39
1ª Qualidade (	L1R-3	54
	L1R-4	60
	LML-1	18
	LML-2	94
Lasca Mista		
	LMR-1	42
	LMR-2	85 
Lasca de	L-2-L	338
2ª Qualidade	L-2-R	117
Lasca de	L-3-L	1250
3ª Qualidade	L-3-R	5452

Tab. 3.9 - Resultados da concentração de H em várias amostras de  $\alpha$ -quartzo brasileiro de diferentes qualidades

## CONCLUSÕES

- Da análise feita na amostra orientada cristalograficamente, vimos que a distribuição de orientação dos dipolos OH, res ponsáveis pela absorção em região infravermelha do espectro eletromegnético em torno de 3 mapresenta um caráter trópico. Assim, na determinação quantitativa de Hidrogênio em %-quartzo, essa anisotropia deverá ser levada em consi deração através do fator de orientação . Como o fator orientação é função do ângulo que os dipolos OH fazem o eixo óptico do cristal e como esse ângulo não deve sofrer muita variação de uma amostra a outra, os resultados dos para os fatores de orientação a partir da determinação do ângulo médio que os dipolos fazem com o eixo c do tal, podem a priori serem utilizados na determinação de em amostra de quartzo orientadas cristalograficamente.
- 2. É claro dos resultados das análises realizadas em vários tipos de 

  —quartzo que a concentração de H pode variar de poucos p.p.m. até grandeza da ordem de 10<sup>3</sup>.
- 3. Para as amostras de 1ª qualidade, as amostras de ambas as jazidas, isto é, de Ribibiu e Limoeiro, apresentam uma con centração de H bastante próximas entre si, sendo a concen

tração sempre menor de 70 p.p.m. Este resultado pode ser comparado com as Tabs. 1.2 e 1.3 do Cap. 1, onde são dados resultados que mostram o intervalo da concentração de H para amostras de 1ª qualidade ou equivalentemente de graneletrônico. Os resultados encontrados se situam no interva lo normal da impureza H, para amostras dessa qualidade.

- 4. Para as lascas mistas, a concentração de H nas amostras de ambas as jazidas, quando comparadas com as lascas de 1ª qualidade não apresentam diferenças significativas en tre si; assim, se o parâmetro H é utilizado como meio de classificação, as lascas mistas podem ser consideradas como material de 1ª qualidade, pois a única diferença que a mesma apresenta é em relação a defeitos visuais em sua es trutura cristalina.
- nas amostras das jazidas de Ribibiu e Limoeiro diferencial significativamente, sendo observado que as lascas de 3ª qualidade de Limoeiro apresenta um grau de pureza bem mais acentuada do que o de Ribibiu, acontecendo o contrário para as lascas de 2ª qualidade.

6. A variação local em uma placa de quartzo da Bahia é da or dem de 2. Sendo encontrado um mínimo de 41 p.p.m. e um máximo de 92 p.p.m. Este resultado foi bem menor do que o encontrado por Chukrabarty e Lemman.

Como conclusão final, poderíamos dizer que a técnica de espectroscopia infravermelha é uma ferramenta bastante poderosa em caracterização do quartzo, pois além de apresentar características não destrutivas, os dados podem ser obtidos de uma forma rápida e segura, diretamente de amostras em estado bruto, sendo mínimos os procedimentos a serem considerados na preparação da amostra para análise, tais como o polimento e o corte da mesma.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. Sokrates T. Pantelides and Water A. Harrison, Phys. Review B, 13, no 6, 2667 (1976).
- 2. F.R. Boyd and J.L. England, J. Geophys. Res., 65, 748 (1960).
- 3. M.C.M. O'Brien, Proc. Roy. Soc., A231, 404 (1955).
- 4. Gerhard Lehmann and H.U. Bambauer, Angew, Chem. Inter. Edit., 12, no 4, 283 (1973).
- 5. E.F. Holden, Amer. Mineral, 10, 203 (1925).
- R. Klemm and G.D. Wild, Zentraldl Mineral. Geol. Palaeontal,
   A23, 737 (1923).
- 7. G. Lehmann, Neves Jahrb. Mineral, Mh., 222 (1969).
- 8. Sawyer Research Products Inc., Quality in Cultured Quartzo.
- 9. J.L. Gillson, Quartz Cirstal and Optical Calcite Industrial
  Mineral and Rocks, ed. AIME, New York, p. 687-695, 3rd. ed.
- 10. J.H.E.Griffiths, J.Owen, and I.M.Ward, in report of the Bristol Conference Defects in Crystalline Solids, the Physical Society. London (1958), p. 81.
- 11. Brunner, G.O., Wondratschek, H. and Lavex, G., Zeit für Glektrochemie, 65, 735 (1961).
  - 12. A. Kats, Philps Res. Repts, 17, (133-195) and (201-279) (1962)
- ∠ 13. H.V. Bambauer, Schweiz. Mineral. Pretrogr. Mitt. 41, 335 (196
  - 14. J.W. Nrelsen and F.G. Foster, Amer. Mineral., 45, 299 (1960).

- 15. F. Iwasaki, J. Crystal Growth, 39, 291 (1977).
- 16. A.J. Cohen, J. Phys. Chem. Solids, 13, 321 (1960).
- 17. W.J. Spencer and K. Hirata, J. Appl. Phys., 37, 549 (1966).
- 18. A.R. Lang and V.F. Mivscov, J. Appl. Phys., 38, 2477 (1967).
- 19. K. Mariya and T. Agowa, J. Crystal Growth, <u>44</u>, 53 (1978).
- 20. K. Moriya and T. Ogawa, Phil. Mag. A., 41, 191 (1980).
- 21. A.G. McLaren, C.F. Osborne and L.A. Saunders, Phys. Stat. Sol., (a) 4, 235 (1971).
- 22. O.A. Erschow, D.A. Goganov, and A.P. Lukirskii, Sov. Phys. Solids State, 7, 1903 (1966).
- 23. O.A. Erschow and A.P. Lukirskii, Sov. Phys. Solids State, 8, 2137 (1966).
- 24. Water G. Cady, Proc. Inst. Radio Eng., 10, 83 (1922).
- 25. D.L. Wood, J. Phys. Chem. Solids, 13, 2310 (1960).
- 26. G. Hass and W.R. Hunter, Appl. Opt., 17, 2310 (1978).
- 27. E.E.Russel and E.E.Bell, J. Opt. Soc. Am., <u>57</u>, 341 (1967).
- 28. E.V.Loewenstein, D.R.Smith and R.L.Morgan, Appl. Opt., <u>12</u>, 398 (1973).
- 29. K.D.Cummings and D.B.Tanner, J. Opt. Soc. Am., 70, 123 (1980).
- 30. D.L. Wood, J. Phys. Chem. Solids, 13, 326 (1960).

- 31. G.O.Brunner, H. Wondratschek and F. Laves, Z. Elektrochem, 56, 735 (1963).
- 32. H.O. Bambauer, G.O. Brunner and F. Laves, Schweiz Mineral Petrol Mitt., 43, 259 (1963).
- 33. D.M. Dood and D.B.Fraser, J. Phys, Chem. Solids, <u>26</u>, 673 (1965).
- 34. B.D. Saksena, J. Phys, Chem. Solids, 27, 465 (1966).
- 35. R.N.Brown and A. Kahan, J. Phys. Chem. Solids, <u>36</u>, 457 (1975).
- 36. D. Chakraborty and G. Lehmann, J. Solids State Chem., 17, 305 (1976).
- 37. D. Chakraborty and G. Lehmann, Phys. State Sol. (a) <u>34</u>, 467 (1976).
- 38. P.A. Staats and O.C. Kopp, J. Phys. Chem. Solids, <u>35</u>, 1029 (1974).
- 39. O.C. Kopp and P.A. Staats, J. Phys. Chem. Solids, 31, 2469 (1970).
- 40. Plyler, E.K., Phys. Rev., 33, 48 (1929).
- 41. Saksana, B.D., Proc. Ind. Acord. Sci., 12A, 93 (1941).
- $\checkmark$  42. Blacis, J.D., Tectonophysics, 27, 271 (1975).
  - 43. Paterson, M.S., Bull Mineral, 105, 20 (1982).

## APÊNDICE

Este apêndice tem como objetivo descrever suncintamente os 2 modêlos proposto por Kats (12) para a incorporação da impureza H na rede cristalina do **2**-quartzo natural.

O primeiro modêlo (fig.1) para a possível posição do ion H+ na estrutura cristalina, explica a origem da banda de absorção - degenerada em 3410cm<sup>-1</sup> e o 2º modelo (fig.2) permite explicar as du as bandas de absorção para 3311cm<sup>-1</sup> e 3305cm<sup>-1</sup>, devido as vibrações de alongamento do dipolo OH.

Com estes dois modêlos, o mesmo concluiu que existem dois possíveis sítios para a impureza H. Um sítio estando localizado no extremo de um tetraedro em volta de um oxigênio, sendo as outras duas posições ocupadas por ions de Al<sup>+3</sup> e Si<sup>+4</sup>, com a direção da vibração de alongamento do dipolo OH, fazendo um ângulo aproxima damente de 75º com o eixo óptico do cristal. O outro sítio estaria entre dois pares de íons de oxigênio e neste caso a direção de vibração sendo exatamente ao longo dos eixos de simetria binária do cristal.

A fig.1 descreve o 1º modelo e mostra as possíveis direções das vibrações de alongamento e deformação para o dipolo OH.

A fig.l mostra que além da vibração de alongamento do dipo lo  $V_1$ , existem duas vibrações de deformação  $V_2$  e  $V_3$ . A primeira vibração de deformação  $V_2$  ocorre em direção paralela a direção Alsi, onde se encontra o oxigênio E. Por sua vez temos que a célula u nitária do  $\alpha$ -quartzo tem seis direções Si-Si, todas fazendo o mesmo ângulo de 539 55' com o eixo C, assim, neste caso, a direção da vibração de deformação  $V_2$  faz um ângulo de 53955' com C. A vibração de alongamento  $V_1$  tem uma direção perpendicular a  $V_2$ . A segunda vibração de deformação  $V_3$ , tem uma direção perpendicular a ambas direções de vibração  $V_1$  e  $V_2$ , sendo o ângulo entre o eixo C e a direção de vibração de 409.

A fig.2 descreve o segundo modêlo e mostra as possíveis di reções de vibrações de alongamento e deformação para o dipolo OH.

A împureza H está localizada entre dois Oxigênios A e B ou C e D no qual representa sítios equivalentes e são circundados por um fon de Al<sup>+3</sup>.

Neste modêlo 3 vibrações podem ocorrer, sendo no primeiro caso denotados por  $V_{11}$ ,  $V_{21}$  e  $V_3$  e no segundo caso por  $V_{12}$ ,  $V_{22}$  e  $V_3$ . Como o ion  $H^+$  está localizado entre dois oxigênio, um das vibrações de alongamento  $V_3$  deve ocorrer ao longo de um dos eixos a de simetria binária que o cristal apresenta (Para melhor detalhe do estrutura cristalina do  $\alpha$ -quartzo, vê Cap.2, secção 2.2. do ref. 12), fazendo um ângulo de 90º com o eixo C.

A segunda vibração  $V_{11}$  ou  $V_{12}$  ocorrerá ao longo da linha que liga dois oxigênios A e B ou C e D, sendo uma vibração de alon gamento entre dois oxigênios e perpendicular a  $V_3$ , fazendo ângulos de 60º 47' e 27º 46' respectivamente com o eixo C do cristal.

A terceira vibração  $V_{21}$  ou  $V_{22}$  deve ter uma direção perpendicular a  $V_3$  e  $V_{11}$  ou  $V_3$  e  $V_{12}$  e são consideradas como vibrações de deformações entre os dois oxigênio correspondente e cujos ângulos com o eixo C são de 24913' e 62914' respectivamente.

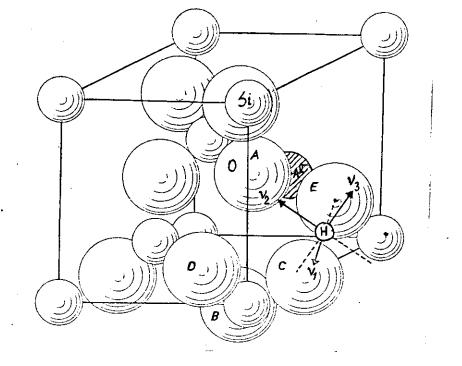


Figura l - Primeiro modêlo para a posição dos ions  $\mbox{H}^{\dagger}$  na rêde cristalina do  $\alpha$ -quartzo natural.

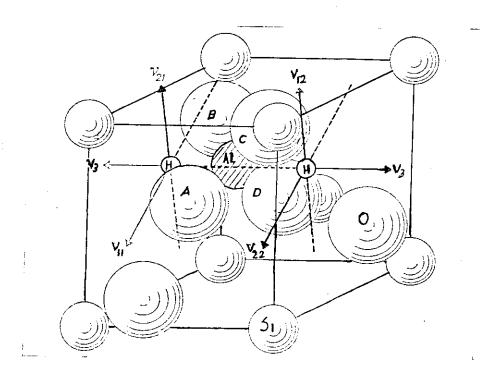


Figura 2 - Segundo modêlo para a posição dos ions  $\mbox{H}^{+}$  na rêde cristalina do  $\alpha$ -quartzo natural.